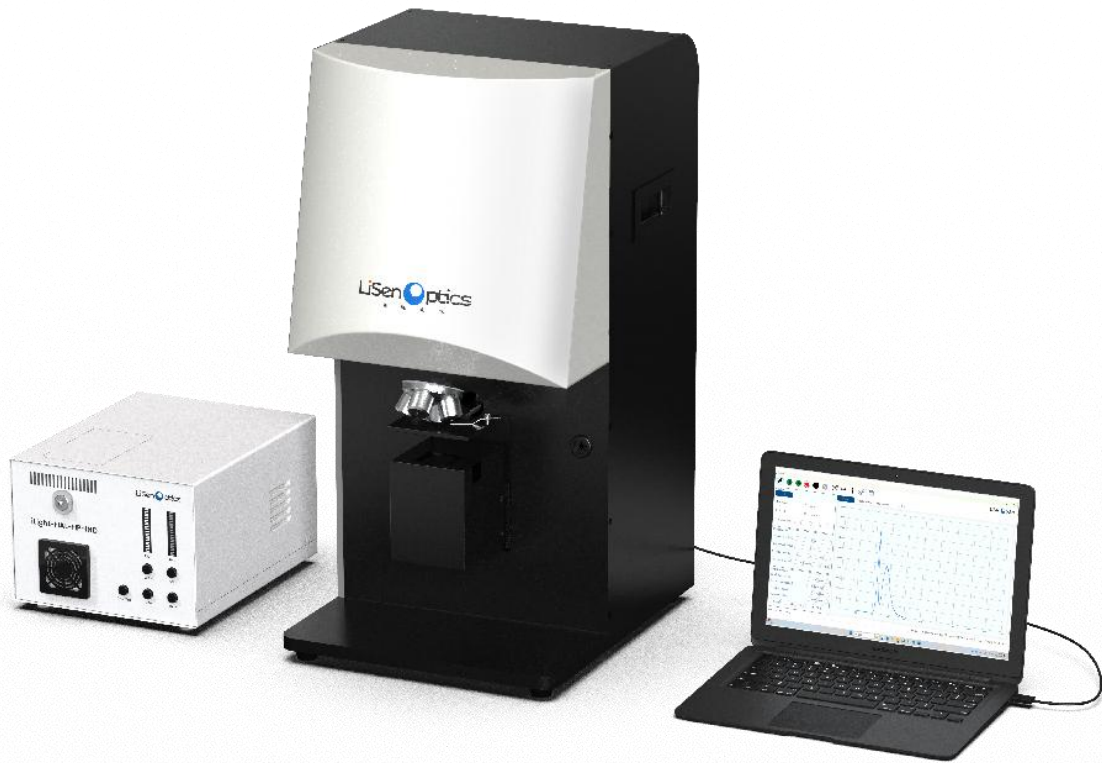


显微球面反射率测量光谱仪

iSpec-R100 显微球面反射率测量光谱仪是莱森光学 (LiSen Optics) 专门针对全波长显微球面光学元件表面反射率测量的最新产品, 适用范围广, 除了能够快速且精确的测量各种光学元件及光学材料、球面与非球面产品 (包括平面镜片) 的相对及绝对反射率, 还可以选配增加光学元件的折射率进行分析。

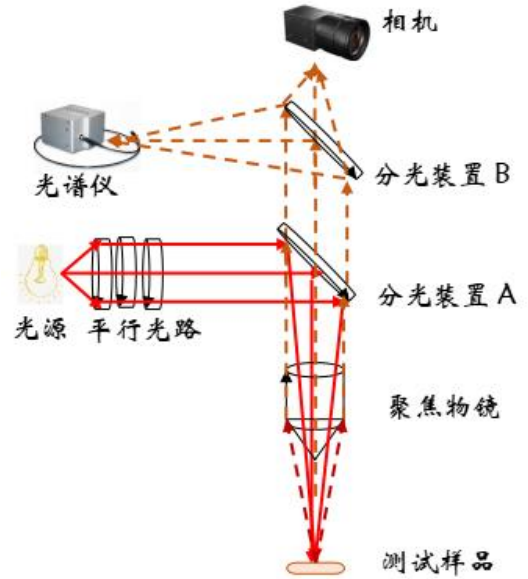
其测试原理: 光源经过平行光路准直后, 被分光装置 A 反射并聚焦在测试样品表面。测试样品的反射光透过分光装置 B 到达相机镜头, 形成清晰的光斑用于对焦。分光装置 B 收集反射光的光谱值, 经由电脑软件分析后计算出测试样品的反射率。



技术优势特点

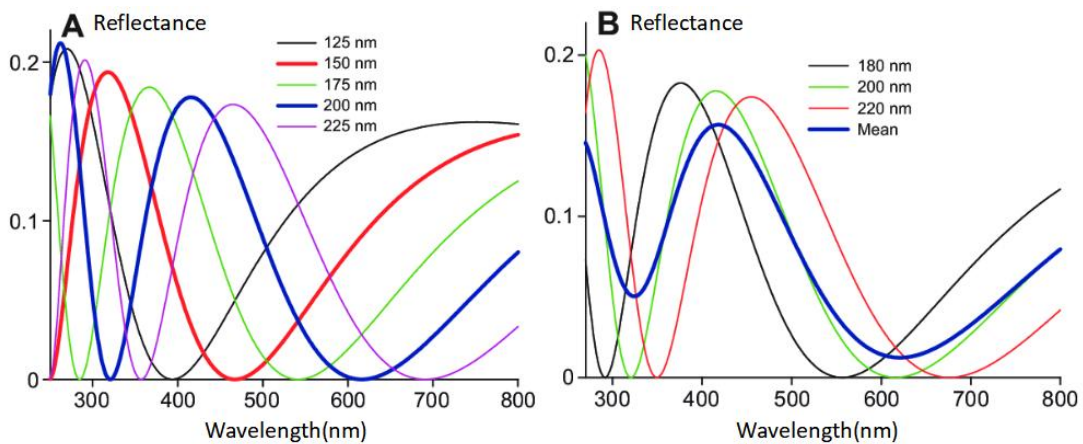
- 使用高景深相机成像, 实现被测区域可视化
- 配备电机实现软件光斑聚焦调节

- 载物台可在 XY 轴移动和 R 方向旋转
- 可进行微小区域测量，支持多个物镜，最小测量区域为 60 μ m
- 具有曲线校正功能和单层光学膜厚计算
- 提供完整的数据存储和报告功能
- 采用高性能光谱探测器和稳定的测试光源



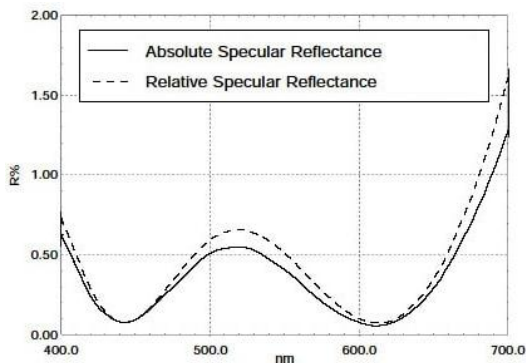
应用领域

- 球面、非球面及平面光学元件的反射率测试
- 微小物体反射、反射颜色率测量
- 滤光片、有机材料、膜材料、镀膜片的反射率检测
- 眼镜片的镀膜测量
- 单层膜的厚度测定

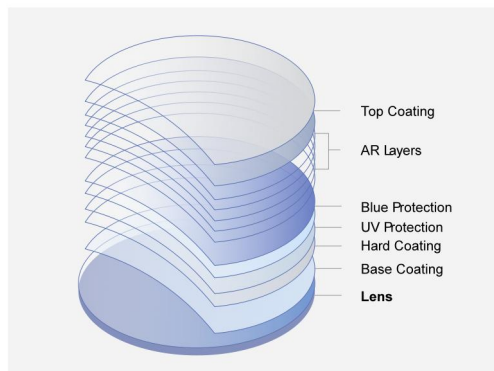


(A) 厚度为 125-225nm 的薄膜的反射光谱和蝴蝶翅鳞片的折射率

(B) 厚度为 180、200 和 220 nm 的薄膜的反射光谱及其平均值



眼镜镜片绝对反射率和相对反射率测量数据



眼镜镜片多层镀膜

主要技术参数

型号	iSpec-R100
波长范围	350-1080nm
光学分辨率 (FWHM)	0.14-7.7nm
波长准确性	≤±0.5%
杂散光	< 0.4%
探测器	线阵 2048 像素 BT-CCD
测试精度	±0.5%@400-450nm; ±0.3%@460-800nm; ±0.5%@800-1000nm
重复性	±0.1%@400-450nm; ±0.08%@460-800nm; ±0.1%@800-1000nm
光斑大小	≥0.3mm@5X (物镜), ≥0.1mm@20X (物镜)
物镜	5X (标准) 10X、20X (可选)
光源寿命	≥2000H
工作温度	0-55°C
洁净度	优于 100000 级
测量功能	反射率、颜色、膜厚、折射率计算